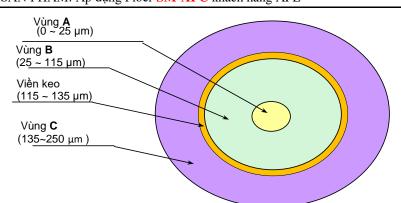
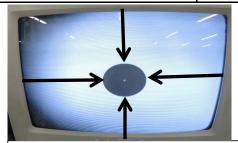
PROCESS SPECIFICATION

Công đoạn áp dụng: Endface tại Polishing Số PS: 000-4-PS-012-0031 Ver: SẢN PHẨM: Áp dụng Fiber SM-APC khách hàng AFL Tài liêu tham khảo: B-00-FF-0003-02





Chỉnh sáng để kiểm tra vùng Cladding và tối để kiểm tra vùng Ziconia

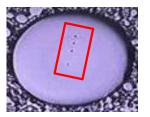


Chú ý: Chỉnh Fiber Endface của sản phẩm ngay tại giữa màn hình để mở rộng vùng quan sát trên màn hình (~ 400um)

Vùng (Đường kính)	Tiêu chuẩn	Đánh giá	Độ phóng đại
Vùng A (0 ~ 25 μm)	Không có bất kì vết xước nào.	OK	X400
	Không có bất kì vết vỡ nào.	OK	
	Không có bất kì vết nứt nào	OK	
Vùng B (25 ~ 115 μm)	Vết xước trắng/đen chiều rộng < 5 μm và không tính số lượng.	OK	
	Vết xước trắng/đen chiều rộng > 5 μm	NG	
	Vết vỡ có đường kính Ø < 2 μm và không tính số lượng.	OK	
	Vết vỡ đường kính $2 \le \emptyset \le 5$ µm và giới hạn bởi 5 vết	OK	
	Vết vỡ có đường kính > 5 μm	NG	
	Không có bất kì vết nứt nào	OK	
Viền keo (115 ~ 135 μm)	Viền keo có bề rộng $<$ 5 μm .	OK	
Vùng C (135 ~ 250 μm)	Vết xước trắng/đen chiều rộng < 10 μm và không tính số lượng.	OK	
	Vết vỡ có đường kính \emptyset < 10 µm và không tính số lượng.	OK	
	Vết vỡ có đường kính $Ø > 10$ μm	NG	
	Không có bất kì vết nứt nào	OK	
Vùng mép vát	Không có keo Epotek dính trên vùng mép vát	Ok	Mắt

Chú ý:

- Vết bẩn yêu cầu được vệ sinh sạch, vết không thể vệ sinh thì đánh giá như lỗi vỡ.
 Đường kính vết vỡ đo theo biên dạng dài nhất. Thông tin cho Leader nếu thấy lỗi bất thường, sản phẩm nếu có chụp hình thì ở ống kiểm X400.
- Trường hợp có 4 vết vỡ thẳng hàng như hình bên, ở bất cứ vùng nào, thì đánh giá NG



FOV 's property, do not take out without FOV BOM's approval Confidential

Trang:1/1

Revision History								
Date	PIC Ve	Vor	Nội dung		Lý do	Người yêu cầu		
		VEI	Nội dung cũ	Nội dung mới	Ly do	Nguoi yeu cau		
21-Aug-24	PhungTK	2	- Công đoạn áp dụng: Endface tại Polishing (Sampling)	- Công đoạn áp dụng: Endface tại Polishing	Sửa lại cho đúng	PhungTK		
3-Jul-24	PhungTK	1	-	-	Ban hành mới.	PhungTK		